

高平坦度シリコンウェーハ

MEMSやFilterなどSubstrateとして最適なウェーハです。

標準C抵抗値 ($\leq 40\Omega\cdot\text{cm}$)・CZ高抵抗 ($10,000\Omega\cdot\text{cmup}$) FZ ($10,000\Omega\cdot\text{cmup}$) 対応

外周除外領域3mm/1mm対応

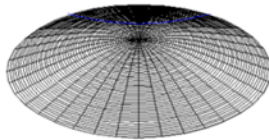
最外周形状をESFQRで解析

ウェーハ凹凸形状を作りこむ事が出来、TTV-bowで数値化

ウェーハ傾きを計量値判定可能 TAPER

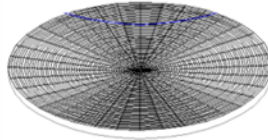
凸形状

TTV-Bowプラス



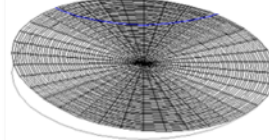
凹形状

TTV-Bowマイナス

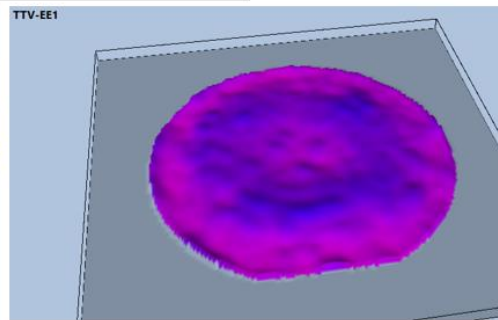
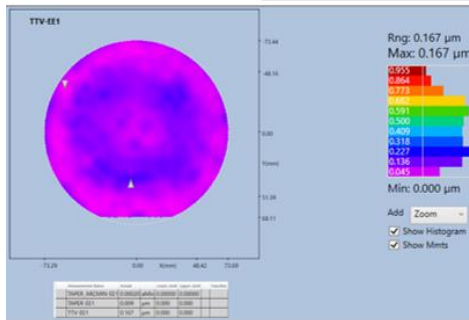


傾き形状

TAPER



代表的なMAP GBIR=0.167 μm ee : 1mm



仕様

・4・6inch_シリコンウェーハ

・GBIR $\leq 0.3\mu\text{m}$ (DSP)

・GBIR $\leq 0.5\mu\text{m}$ (SSP)

・厚み $\leq 500\mu\text{m}$

主な平坦度保証項目

G/S	Reference		calculation	Item
Global	Surface	3-point	Range	GF3R
			deviation	GF3D
		Best Fit	Range	GFLR
			deviation	GFLD
	Back	Back Side	Range	GBIR
			Angle Range deviation	TAPER TTV-BOW
Site	Surface	Global 3-point	Range	SF3R
			deviation	SF3D
		Global Best Fit	Range	SFLR
			deviation	SFLD
		Site Best Fit	Range	SFQR
			deviation	SFQD
	Back	Back Side	Range	ESFQR
			deviation	SBIR SBID
Global	Surface	3-point	Range	WARP
			deviation	BOW
		Best Fit	Range	SORI

Measurements byUltraSort200- II @Toropel



silicon-tokyo@carlit.co.jp

Kyobashi One Terrace. 6F
1-17-10 Kyobashi, Chuo-Ku, Tokyo, Japan 104-0031

Phone 81-3-6685-2020 FAX 81-3-6685-2080

URL <http://www.carlithd.co.jp/silicon/>

Copyright © 2025 Carlit Co., Ltd. All Rights reserved.